

試験項目数算出手順

プログラムの合計規模より『試験項目数／誤り件数』を算出する。
 試験仕様書において、『試験項目数』以上の試験項目を作成する。
 試験成績書において、誤り件数分の『誤り』を発見することを目標とし、試験結果の評価を実施する。

プロセス数 (合計)	機能 or プロセス数	合計規模 (KL)				試験項目数 (件)	誤り件数 (件)	試験密度 (%)	誤り 検出率 (%)	ヒット 率 (%)	残存 誤り率 (%)	評価	
		新規 (KL)	改造 (KL)	流用 (KL)	換算率 (%)							品質	見通
0	0	0.0	0.0	0.0	10	0	0	80.0	6.00	0.0	0.00		

入力項目	単位	入力可能範囲		基準値	仕様
		下限	上限		
プロセス数 (合計)	本				
機能 or プロセス数	本				
合計規模	KL				新規 + 改造 + {流用 × (換算率 ÷ 100)}
	新規	KL	0	-	-
	改造	KL	0	-	-
	流用	KL	0	-	-
	換算率	%	0	100	10
試験項目数	件				(合計規模 × 1,000) × (試験密度 ÷ 1,000) [小数点以下四捨五入]
誤り件数	件				(合計規模 × 1,000) × (誤り検出率 ÷ 1,000) [小数点以下四捨五入]
試験密度 (1KLあたり)	単体	%	70.0	100.0	80.0
	結合	%	40.0	60.0	50.0
	総合	%	20.0	40.0	30.0
誤り検出率 (1KLあたり)	単体	%	0.00	9.99	6.00
	結合	%	1.00	3.00	2.00
	総合	%	0.05	1.00	0.10
ヒット率	%				(誤り件数 ÷ 試験項目数) × 100
残存誤り率	%				{誤り件数 ÷ (合計規模 × 1,000)} × 100
評価	品質				以下のいずれかの評価記号を入力
					◎ 品質優 ○ 品質良好 △ 品質不良 × 品質劣
評価	見通				以下のいずれかの評価記号を入力
					◎ 見通しあり ○ 見通しややあり △ 見通しややなし × 見通しなし